

ナノプローブテクノロジー第167委員会 第77回研究会 予定内容

「SPM 複合計測機器」

ここ数年の SPM 複合計測機器の進展には目を見張るものがある。特に化学分析と複合化した SPM/ラマン計測や SPM/IR 計測は今後の SPM 利用者の門戸を大幅に広げる可能性が高い。本研究会では、これら SPM 複合計測機器の現状と展望について、一線で活躍する講師を招いて討論する。

日時：2015 年 1 月 8 日（木）

場所：東京大学生産技術研究所・駒場リサーチキャンパス An 棟 2 階コンベンションホール

プログラム

13:00～13:10 事務連絡

13:10～13:50 「SPM による化学分析のロードマップ ～最近のナノ IR 計測の展開～」

叶 際平 日産アーク

13:50～14:30 「AFM / IR ナノケミカル ID とナノ機械特性」

鈴木 操 ブルカー・エイエックスエス

14:30～15:30 「Single-molecule Raman spectromicroscopy down to sub-nm spatial resolution」

Zhenchao Dong 中国科学技術大学

15:30～15:50 休憩

15:50～16:30 「AFM ラマンの現状と課題」

吉村 雅満 豊田工業大学

16:30～17:10 「AFM と SEM の融合技術および電気計測技術との組み合わせ」

岩田 敏一 東陽テクニカ

17:20～19:20 懇親会（場所未定）

企画委員

NIMS 藤田大介

東京大学 川勝英樹

ブルカー・エイエックスエス 後藤千絵

東北大学 中嶋健